



Initial Product/Process Change Notification

Document #:IPCN23694X

Issue Date:17 Nov 2020

Title of Change:	Transfer of Assembly and Test site operations of Small Signal Junction Field Effect Transistor devices in TO-92 from AUKD (China) to JCET(China).										
Proposed First Ship date:	24 Feb 2021 or earlier if approved by customer										
Contact Information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or Jason.Choy@onsemi.com										
PCN Samples Contact:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or < PCN.samples@onsemi.com >. Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.										
Type of Notification:	This is an Initial Product/Process Change Notification (IPCN) sent to customers. An IPCN is an advance notification about an upcoming change and contains general information regarding the change details and devices affected. It also contains the preliminary reliability qualification plan. The completed qualification and characterization data will be included in the Final Product/Process Change Notification (FPCN). This IPCN notification will be followed by a Final Product/Process Change Notification (FPCN) at least 90 days prior to implementation of the change. In case of questions, contact < PCN.Support@onsemi.com >										
Marking of Parts/ Traceability of Change:	Customer may receive the parts from JCET once FPCN expired or earlier depending on customer approval. Parts from new assembly and test site can be identify through product marking which follow ON Semiconductor marking format.										
Change Category:	Test Change, Assembly Change										
Change Sub-Category(s):	Manufacturing Site Transfer										
Sites Affected:											
ON Semiconductor Sites	External Foundry/Subcon Sites										
None	AUKD, China										
	JCET, China										
Description and Purpose:											
<p>This notification announces the transfer of Assembly and Test Site on the Junction Field Effect Transistor packaged in TO-92 from AUKD (China) to JCET (China).</p> <p>This change was resulted from AUKD (China) Assembly and Test site closure. The new site in JCET has been an existing qualified manufacturing site for ON Semiconductor which certified with IATF16949:2016.</p> <p>Products listed in this notification will continue to be Pb-free, Halide free and RoHS compliant. Qualification tests are designed to show that the reliability of the transferred devices will continue to meet or exceed ON Semiconductor standard.</p> <p>Site Change:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Before Change</th> <th>After Change</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Assembly Location</td> <td>AUKD, China</td> <td>JCET, China</td> </tr> <tr> <td>Final Test Location</td> <td>AUKD, China</td> <td>JCET, China</td> </tr> </tbody> </table>				Before Change	After Change	Assembly Location	AUKD, China	JCET, China	Final Test Location	AUKD, China	JCET, China
	Before Change	After Change									
Assembly Location	AUKD, China	JCET, China									
Final Test Location	AUKD, China	JCET, China									



TO92 Piece Part Change :

	Before Change	After Change
LeadFrame	CuAg STAMPED	No Change
Die Attach	Eutectic	No Change
Wire	Au wire	No Change
Mold Compound	Changchun EME 2500 D3	HHCK EMG-200

Reliability Data Summary:

QV DEVICE NAME : J109

PACKAGE : TO-92

Test	Specification	Condition	Interval
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100 % max rated V	1008 hrs
H3TRB	JESD22-A101	Ta=85°C, 85% / 80% max rated V	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs
UHASt	JESD22-A118	Ta= 130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to 150°C	1000 cyc
IOL	MIL STD750 (M1037) AEC Q101	Ta=+25°C, deltaTj=100°C On/Off = 2 min	15000 cyc
RSH	JESD22- B106	Ta = 260C, 10 sec	

List of Affected Parts:

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the PCN Customized Portal.

Part Number	Qualification Vehicle
J58	J109
J111-D26Z	J109
J111-D74Z	J109
J112-D26Z	J109
J112-D27Z	J109
J112-D74Z	J109
J113-D74Z	J109
J109-D26Z	J109
J176-D74Z	J109
J111	J109



Initial Product/Process Change Notification

Document #:IPCN23694X

Issue Date:17 Nov 2020

J112	J109
J113	J109
J109	J109
J175-D26Z	J109
J211-D74Z	J109
BF256B	J109

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN23694X

発行日: 17 Nov 2020

変更件名:	TO-92 の小信号ジャンクション電界効果トランジスタの組立および検査拠点のオペレーションを AUKD (中国) から JCET (中国) に移管										
初回出荷予定日:	24 Feb 2021 またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前										
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または < Jason.Choy@onsemi.com > にお問い合わせください。										
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または < PCN.Samples@onsemi.com > にお問い合わせください。サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。										
通知種別:	これは、お客様宛の初回製品 / プロセス変更通知 (IPCN) です。IPCN は、近日中に実施される変更に関する事前通知であり、変更の詳細および影響を受けるデバイスについての一般情報が記載されます。また、暫定的な信頼性認証計画も記載されます。最終的な認定データおよび特性データは最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に含まれます。この IPCN は、変更実施から少なくとも 90 日前に発行される最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に先だって通知されます。ご不明な点がありましたら、< PCN.Support@onsemi.com > にお問い合わせください。										
部品のマーキング/変更のトレーサビリティ:	お客様は JCET からの製品を、FPCN の期間満了後またはお客様の承認があればその前から受け取るようになります。新しい組立および検査拠点からの製品は、オン・セミコンダクターのマーキングフォーマットに準拠した製品マーキングにより識別できます。										
変更カテゴリ:	検査の変更, 組立の変更										
変更サブカテゴリ:	製造拠点の移管										
影響を受ける拠点:											
外部製造工場 / 下請業者拠点:	外部製造工場 / 下請業者拠点:										
なし	AUKD, China										
	JCET, China										
説明および目的:	<p>この通知は、TO-92 パッケージのジャンクション電界効果トランジスタの組立および検査拠点を AUKD (中国) から JCET (中国) に移管することをお知らせするものです。</p> <p>この変更は AUKD (中国) の組立および検査拠点の閉鎖に起因したものです。JCET の新拠点は、IATF16949:2016 の認証を受けた既存のオン・セミコンダクター認定製造拠点です。</p> <p>本通知にリストされている製品は引き続き鉛フリー、ハロゲン化合物フリーであり、RoHS に適合しています。品質試験は、移管された製品の信頼性が引き続きオン・セミコンダクターの基準以上となることを証明するように設計されています。</p> <p>拠点の変更:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>変更前の表記</th> <th>変更後の表記</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>組立拠点</td> <td>AUKD, China</td> <td>JCET, China</td> </tr> <tr> <td>最終検査拠点</td> <td>AUKD, China</td> <td>JCET, China</td> </tr> </tbody> </table>			変更前の表記	変更後の表記	組立拠点	AUKD, China	JCET, China	最終検査拠点	AUKD, China	JCET, China
	変更前の表記	変更後の表記									
組立拠点	AUKD, China	JCET, China									
最終検査拠点	AUKD, China	JCET, China									



初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN23694X

発行日: 17 Nov 2020

TO92 部品の変更:

	変更前の表記	変更後の表記
リードフレーム	CuAg STAMPED	変更なし
ダイ接着剤	Eutectic	変更なし
ワイヤ	Au ワイヤ	変更なし
モールド・コンパウンド	Changchun EME 2500 D3	HHCK EMG-200

信頼性データの要約:

デバイス名 : J109

パッケージ : TO-92

テスト	規格	条件	間隔
HTRB	JESD22-A108	Ta=150° C, 100 % max rated V	1008 hrs
H3TRB	JESD22-A101	Ta=85° C, 85% / 80% max rated V	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150° C	1008 hrs
UHASt	JESD22-A118	Ta= 130° C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
TC	JESD22-A104	Ta= -55° C to 150° C	1000 cyc
IOL	MIL STD750 (M1037) AEC Q101	Ta=+25° C, deltaTj=100° C On/Off = 2 min	15000 cyc
RSH	JESD22- B106	Ta = 260C, 10 sec	

影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
J58	J109
J111-D26Z	J109
J111-D74Z	J109
J112-D26Z	J109
J112-D27Z	J109
J112-D74Z	J109
J113-D74Z	J109
J109-D26Z	J109
J176-D74Z	J109



初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN23694X

発行日: 17 Nov 2020

J111	J109
J112	J109
J113	J109
J109	J109
J175-D26Z	J109
J211-D74Z	J109
BF256B	J109



Appendix A: Changed Products

Product	Customer Part Number	Qualification Vehicle	New Part Number	Replacement Supplier
J111-D26Z		J109	NA	
J111-D74Z		J109	NA	
J211-D74Z		J109	NA	
J112-D26Z		J109	NA	
J112-D27Z		J109	NA	
J112-D74Z		J109	NA	
J113-D74Z		J109	NA	
J109-D26Z		J109	NA	
J176-D74Z		J109	NA	
J111		J109	NA	
J112		J109	NA	
J113		J109	NA	
J109		J109	NA	
J175-D26Z		J109	NA	
BF256B		J109	NA	